



UNIVERSITÀ DI PISA

**titolo brevetto**

**Metodo e dispositivo optoelettronico per una valutazione quantitativa di qualità di una superficie**

**titolare**

Università di Pisa

**inventori**

Michele Lanzetta  
Giovanni Tantussi  
Santo Gentile

**tipo di brevetto**

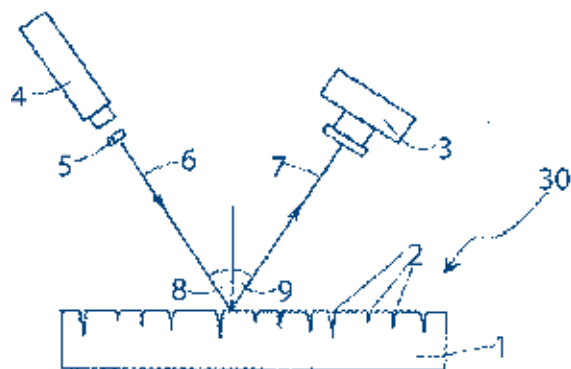
PI 2007A000105 del 10/9/2007

**descrizione dell'invenzione (abstract)**

Un metodo ed un dispositivo optoelettronico per misurare la rugosità di una superficie, in cui è prevista una sorgente luminosa che emette un fascio luminoso incidente verso una superficie da analizzare secondo un angolo di incidenza prefissato. È previsto un sensore di luce in grado di rilevare una componente del fascio incidente riflessa specularmente secondo un angolo di riflessione sostanzialmente uguale all'angolo di incidenza. È poi prevista la proiezione del fascio incidente sulla superficie da analizzare tramite la sorgente luminosa e la misurazione tramite il sensore dell'intensità della componente riflessa specularmente. Quindi, viene separata la componente riflessa specularmente dalla luce diffusa dalla superficie in questione, e infine viene correlata l'intensità della componente riflessa specularmente con un parametro di rugosità della superficie in questione.

Ufficio Ricerca • Lungarno Pacinotti 43 • 56100 Pisa  
e-mail: [ricerca@adm.unipi.it](mailto:ricerca@adm.unipi.it) • sito web: [www.unipi.it/ricerca](http://www.unipi.it/ricerca)

## disegno



## aree di applicazione principali

Aziende del settore optoelettronico e produttori di macchinari e attrezzature nel settore lapideo